

(上接第 261 页)

种用来研究特定介质声学动力学(如声速、声速色散、声子衰减)以及弹性力学特征的新方法。

参 考 文 献

- [1] J. A. Armstrong et al., *Phys. Rev.*, **127** (1962), 1918; P. A. Franken, J. F. Ward, *Rev. Mod. Phys.*, **35** (1963), 23; P. S. Pershen, *Progress in Optics*, **5** (1966), 85; J. Dueuing, *Quantum Optics*, Academic Press, (1969), 421.
- [2] D. N. Nikogosyan, *Sov. J. Quantum Electron.*, **7** (1977), 1.
- [3] Y. R. Shen, *Progr. Quantum Electron.*, **4** (1976), 207.
- [4] R. Baumgartner, R. L. Byer, *J. Opt. Soc. Am.*, **68** (1978), 688; G. A. Massey, J. C. Johnson, *IEEE J. Quantum Electron.*, **15** (1979), 201.
- [5] R. W. Hellwarth, *Progr. Quantum Electron.*, **5** (1977), 1.
- [6] H. Puell, C. R. Vidal, *Opt. Commun.*, **18** (1976), 107; D. M. Bloom et al., *Appl. Phys. Lett.*, **26** (1975), 687.
- [7] L. J. Zych, J. F. Young, *IEEE J. Quantum Electron.*, **14** (1978), 147; H. Egger et al., *Opt. Lett.*, **5** (1980), 282.
- [8] S. C. Wallace, G. Zdasiuk, *Appl. Phys. Lett.*, **28** (1976), 449; C. Wallace et al., *Opt. Commun.*, **18** (1976), 110.
- [9] N. Bloembergen, P. Lallement, *Phys. Rev. Lett.*, **16** (1966), 81; C. W. Cho et al., *Phys. Rev. Lett.*, **18** (1967), 107.
- [10] R. M. Herman, M. A. Gray, *Phys. Rev. Lett.*, **19** (1967), 824; D. H. Rank et al., *Phys. Rev. Lett.*, **19** (1967), 828; N. Bloembergen et al., *Phys. Rev. Lett.*, **25** (1970), 1476.
- [11] 激光物理学编写组, *激光物理学*, 上海人民出版社, (1975), 233.
- [12] D. Cotter et al., *Opt. Commun.*, **16** (1976), 256; D. Cotter, D. C. Hanna, *Opt. Quantum Electron.*, **9** (1977), 509.
- [13] P. Rabinowitz et al., *Appl. Phys. Lett.*, **35** (1979), 739.
- [14] R. L. Byer, W. R. Trutna, *Opt. Lett.*, **3** (1978), 144.
- [15] C. K. N. Patel, E. D. Shaw, *Phys. Rev. Lett.*, **24** (1970), 451; S. D. Smith et al., *Progr. Quantum Electron.*, **5** (1978), 205.
- [16] S. R. J. Brueck, A. Mooradian, *Opt. Commun.*, **18** (1976), 15.
- [17] R. Y. Chiao et al., *Phys. Rev. Lett.*, **12** (1964), 592; C. L. Tang, *J. Appl. Phys.*, **37** (1966), 2945.

用广角纪尼叶单色聚焦相机精确测量钆镓石榴石的点阵常数

车 广 灿 梁 敬 魁

(中国科学院物理研究所)

文献[1]对德拜-谢乐照相中精确测定点阵常数的方法进行了研究。用衍射仪精确测量多晶点阵常数的方法,在文献[2]中作了归纳总结。本文简要介绍用广角纪尼叶(Guinier)相机精确测定钆镓石榴石(GGG)和掺杂钆镓石榴石点阵常数的方法和结果。

一、广角纪尼叶单色聚焦相机的特点

广角纪尼叶相机与纪尼叶四重聚焦粉末相机的基本原理相同^[3]。广角纪尼叶相机的主要特点是,可收集到角度很广(1—89°)的衍射

线和可得到严格的单色入射辐射。我们使用的Huber 广角纪尼叶相机,通过适当的调节可获得严格的 K_{α_1} 辐射。

众所周知,点阵常数测量的精度,取决于衍射线位置测量的准确度,各种误差的消除和校正以及衍射线对应的波长的准确度。严格的单色辐射,不但给衍射线的解析,衍射角的精确测量带来方便,同时还能给出衍射线对应的准确波长。由于 $\Delta d/d = -\cot\theta \cdot \Delta\theta$, 在衍射线位置测量准确度相同的情况下,衍射线的角度愈高,则面间距 d 的相对误差(或立方晶系点阵常数的相对误差)愈小。因此,用广角纪尼叶相机

测量点阵常数有可能达到非常高的准确度。

二、相机“刀边”常数的标定

由于底片显影、定影中冲洗温度和时间的不同，底片的长度将发生明显变化。为了测得衍射线的准确 θ 值，通常加入内标，用内标物质衍射线作标准加以修正。然而内标物质的衍射线有时与未知物质的衍射线相重叠，而且由于内标物质的存在，也可能降低试样的衍射强度，从而给测试工作造成困难。Stoe公司的广角纪尼叶相机采用的办法是在底片盒的上下部，每隔 5° 刻有角度参考线，用以校正衍射线的位置。我们使用的广角纪尼叶相机没有这种角度参考线。我们认为采用标定“刀边”的办法同样可以达到理想的效果。因为照片上“刀边”间所对应的角度，对于同一底片盒来说是一个常数。用Huber广角纪尼叶相机准确测量点阵常数，采用对称背反射技术，测量的衍射线的角度范围在 $58\text{--}89^\circ$ 之间。将图1中A,B之间的距

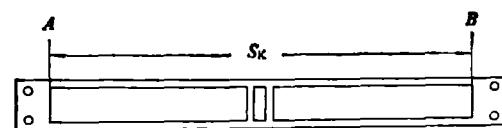


图1 对称背反射法“刀边”位置示意图

离所对应的衍射角定义为相机的“刀边”常数，用 θ_K 表示。我们用中国科学院半导体研究所生长的纯硅单晶粉末作为标准试样，采用文献[1]叙述的方法测得的点阵常数为 $5.43075\text{--}5.43096\text{\AA}$ ，计算时采用 5.43086\AA 。由于“刀边”清晰，测量的准确度较高。“刀边”及衍射线位置用剑桥比长仪测量，测量精度为 $\pm 0.01\text{mm}$ ，即衍射角的测量精度为 $\pm 0.0025^\circ$ 。对于我们使用的Huber广角相机，在对称背反射的情况下，用Si作标准样品，测得的 $\theta_K = 64.150^\circ$ 。对于对称背反射技术，衍射角的精确计算方法如下：

$$\theta = 90^\circ - [\theta_K \times \text{同一衍射线对之间的距离} (\text{mm}) / 2S_k (\text{mm})]$$

三、校 验

通过对NaCl点阵常数的测定，校验“刀边”的标定结果和确定测量精度。用分析纯NaCl的饱和水溶液加入无水酒精得到颗粒度很细的NaCl沉淀，烘干、研细后作为标准样品。在上述角度范围内，对于NaCl可获得(620)，(640)两条清晰的衍射线。 θ 角的测定结果分别为 64.962° 和 80.050° ，计算得的点阵常数 a 分别为 5.63923\AA 和 5.63921\AA (CuK_α 波长取 1.54051\AA)。所得点阵常数与平均值的偏差 $\leq \pm 0.00015\text{\AA}$ ，即相对误差小于 3×10^{-5} 。如果测量相对误差小于 1×10^{-5} ，则必须进行折射率校正。

$$a_{\text{cor}} = a_{\text{obs}}(1 + \Delta n)$$
$$= a_{\text{obs}} \left(1 + 2.71 \times 10^{-6} \lambda^2 \rho \frac{\sum Z}{\sum A} \right),$$

其中 a_{cor} 表示校正后的点阵参数， Δn 为折射率校正项， ρ 为样品密度， λ 为辐射波长， $\sum Z$ 为单胞中全部原子序数总和， $\sum A$ 为单胞中全部原子的原子量总和，可以预料，如果在更高角度存在强的衍射线，测量准确度仍可以提高。对于NaCl试样的测定结果，与文献中通常采用的NaCl的点阵常数 $5.63919\text{--}5.63946\text{\AA}$ 是相当一致的。

四、钆镓石榴石和掺杂钆镓石榴石点阵常数的测量

作为良好的磁泡衬底材料，它必须与外延的磁性薄膜的点阵常数相近，以实现衬底与外延薄膜的点阵常数匹配。GGG($\text{Gd}_3\text{Ga}_5\text{O}_12$)是石榴石型结构中具有较大点阵常数的晶体，因此成为外延生长YIG的良好衬底材料。显然对于这一类材料，点阵常数的精确测量是十分重要的。我们用对称背反射法，在衍射角大于 64° 的范围，得到四条清晰的衍射线，其相应的面指数为 $H^2 + K^2 + L^2 = 212, 216, 244, 248$ ，测定结果见表1。

表 1 GGG 和掺杂 GGG 的点阵常数*

GGG 晶体的点阵常数(Å)		掺 Ca ²⁺ 和 Zr ⁴⁺ 的 GGG 的点阵常数(Å)**	
头部	尾部	晶体	剩料
12.3824	12.3822	12.4154	12.4235

* 18°C 的点阵常数。

** 掺 Ca²⁺ 和 Zr⁴⁺ GGG 的配料成分: CaO 1.59 wt%, ZrO₂ 2.95 wt%, Gd₂O₃ 49.5 wt%, Ga₂O₃ 45.6 wt%。

从表 1 可见, 纯 GGG 晶体头部和尾部点阵常数基本相同, 说明 GGG 晶体是同成分熔化。同时, 由于 Gd³⁺ 与 Ga³⁺ 离子半径差别较大^[4], Ca²⁺ 的离子半径与 Ga³⁺ 相近, Zr⁴⁺ 的离子半径比 Gd³⁺ 小, 比 Ga³⁺ 大。为了保持晶体电荷平衡, 根据掺杂 GGG 点阵常数变大的事实, 只

可能是 Ca²⁺ 替代 Gd³⁺, Zr⁴⁺ 替代 Ga³⁺, 形成固溶体。剩料的点阵常数比拉出的晶体点阵常数大, 也就是说剩料中的 CaO 与 ZrO₂ 的含量比单晶体中的含量多。这说明 Ca²⁺, Zr⁴⁺ 在掺杂固溶体中的分凝系数小于 1。

致谢: GGG 样品是由张乐潭先生提供的, 在此表示感谢。

参 考 文 献

- [1] 陆学善, 物理学报, 29 (1980), 273.
- [2] 侯敬魁, 物理, 10 (1981), 301.
- [3] 纪尼叶著, 施士元译, X 射线晶体学, 科学出版社, (1959), 164—178.
- [4] Lange, Handbook of Chemistry, 10Ed., McGraw-Hill Book Company Inc., New York, Toronto, London, (1961), 108.

一轴晶棒状晶体的快速定向法

刘 来 保

(中国科学院安徽光学精密机械研究所)

一、前 言

目前, 无表面方位特征的棒状晶体的定向都是采用经典的方法——劳厄定向法。

作者在对下降法自发生长的淡红银矿、硫镓银、硒镓银等棒状晶体的定向过程中, 发现这些晶棒的侧表面均有某个部位的似平面法线为 $\langle h00 \rangle$ 或 $\langle hh0 \rangle$ 方向。也就是说, 虽然生长轴与光轴夹角大小不等, 但生长轴都位于 ZY 或 ZX (四方晶系 $Z\langle hh0 \rangle$) 平面内(见图 1, 2 和表 1)。本工作就是利用这种潜在的结晶学特点来简化定向过程的。另外, 对近 50 根火焰法和提拉法生长的红宝石(生长轴与光轴的夹角都在 60°—70° 左右)棒也进行了研究, 发现其生长轴基本上都位于 ZX 平面内, 少数位于 ZY 平面内。因此, 也可以采用同样的方法定向。

表 1

晶体名称	晶系	实验样品数**	相符柱面	反射角 θ	
				理论值	实测值
红宝石 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	三方*	45	(030)	34°8'	30—45°***
		2	(110)	18°55'	20—22°
淡红银矿 Ag_2AsS_3	三方	2	(030)	14°35'	14—15°
		9	(020)	15°54'	13—20°
硫镓银 AgGaS_2	四方	1	(220)	22°17'	22°00'
		1	(020)	14°56'	15°30'
硒镓银 AgGaSe_2	四方	15	(040)	14°54'	14—17°
		3	(220)	10°29'	7—11°

* 有的学者也将红宝石归入六方晶系。

** 为全部实验样品数, 未发现例外现象。

*** 红宝石全为成品棒, 由于毛坯较粗, 在切取时有选择性, 故往往不是完全平行棒轴切割, 因此差角较大。